

Primera Convocatoria

Objetivos

- Contribuir a que se reconozca y desarrolle la Metrología como una disciplina relevante para la industria, el comercio, la ciencia y la técnica.
- Fomentar la comunicación y colaboración en Metrología.
- Difundir los conocimientos y experiencias generados en el CENAM, laboratorios de calibración, laboratorios de pruebas, industria, instituciones de investigación, desarrollo tecnológico y normalización.
- Contribuir a fortalecer una cultura de mediciones en el país.
- Estrechar vínculos entre los miembros de la comunidad metroológica.

Dirigido a

- Personal de la industria involucrado en mediciones.
- Personal de laboratorios de calibración y pruebas.
- Fabricantes, distribuidores y usuarios de equipo de medición.
- Auditores de calidad.
- Gerentes y técnicos en calidad.
- Evaluadores de laboratorios.
- Profesores, investigadores y estudiantes involucrados con la metrología.

Temas:

- **Metrología Industrial y Legal**
 - + Métodos relacionados con medición.
 - + Instrumentos y sistemas de medición.
 - + Trazabilidad.
 - + Estimación de incertidumbres en mediciones.
 - + Validación de métodos.
 - + Acreditación de laboratorios de calibración y pruebas.
 - + Comparaciones entre laboratorios.
 - + Aplicaciones de materiales de referencia.
 - + Mediciones ambientales.
 - + Evaluación de la conformidad.
 - + Normalización.
- **Metrología Científica**
 - + Patrones primarios y sistemas de medición de alta exactitud.
 - + Nuevos métodos de medición.
 - + Nuevos patrones de medición.
 - + Metrología de métodos primarios en mediciones analíticas.
 - + Comparaciones internacionales y acuerdos de reconocimiento mutuo.

Formas de participación

- **Asistente**
- **Ponente**
- **Patrocinador**

Formas de ponencia

- **Oral**
- **Cartel**

Ponencia

Fecha límite para recepción de resúmenes: **31 de marzo de 2004**

Recepción de trabajos en extenso: **18 de junio de 2004**

La aceptación de los trabajos estará sujeta a la evaluación del Comité Técnico

Resumen:

- Número de palabras: Entre 100 y 200
- Tamaño de hoja: Carta (21,5 x 28,0 cm)
- Fuente: Arial, 12 puntos, con líneas a un sólo espacio
- Título: Mayúsculas seguido por una línea blanca y en seguida los nombres de los autores y su afiliación, todos centrados en la parte superior de la página

Cuotas de recuperación

- **Ponentes y asistentes: \$3,950.00** más I.V.A.
Incluye memorias y constancia de asistencia, 3 comidas, 1 cena, servicio de cafetería.
- **Patrocinadores: \$ 20,000.00** por espacio para exhibición de equipo o,
\$ **8,000.00** por espacio para exhibición de un póster comercial.
Incluye la asistencia de una persona al Simposio, memorias, 3 comidas, 1 cena, servicio de cafetería y la inclusión del logotipo de su empresa en los medios de difusión del Simposio.

\$ **2,000.00** más I.V.A. por persona adicional (hasta dos adicionales).
- **Estudiantes con credencial vigente: \$1,500.00** más I.V.A.
Incluye asistencia al simposio, memorias, 3 comidas, 1 cena, servicio de cafetería.
- **Cuotas válidas hasta el 31 de julio de 2004**

Información adicional / Comité Organizador

- **Erika Montaña Suárez:**
Teléfono: (442) 211 05 00 al 04, ext. 3013
Directo: (442) 211 05 83
Correo electrónico: simposio@cenam.mx
Fax: (442) 211 05 00 al 04, ext. 3012
- **Coordinador: Roberto Arias Romero**
Teléfono: (442) 211 05 71

PRE-REGISTRO SIMPOSIO DE METROLOGÍA 2004

Para enviar a:

Erika Montaña Suárez

Comité Organizador Simposio

Tel. +52 (442) 211 05 00 al 04, ext. 3013

Dcto: +52 (442) 211 05 83

Fax: +52 (442) 211 05 00 al 04, ext. 3012

Correo electrónico: simposio@cenam.mx

Me interesa participar como:

Asistente

Ponente

Presentación Oral

Cartel

Tópico: _____

Clasificación No.

Para el no. de clasificación, consultar formato anexo en pág. 4

Anexar en su caso resumen de su ponencia (oral o cartel)

Patrocinador

Con espacio para exhibición

Con espacio para Póster

Mis datos son:

Nombre: _____

Organización: _____

Domicilio: _____

Teléfono y fax: _____

Correo electrónico: _____

Será informado con oportunidad de las fechas y modalidades para formalizar su participación.

LISTADO DE DISCIPLINAS

1) Mediciones Electromagnéticas

- a) Mediciones en corriente continua
- b) Mediciones en baja frecuencia
- c) Mediciones en radiofrecuencia y microondas
- d) Mediciones magnéticas

2) Tiempo y Frecuencia

3) Temperatura y Humedad

- a) Termometría de contacto
- b) Pirometría
- c) Humedad
- d) Conductividad y transferencia de calor

4) Óptica y Radiometría

- a) Radiometría de detectores y fuentes
- b) Fotometría
- c) Caracterización óptica de materiales:
espectrofotometría, color, polarimetría, etc.
- d) Fibras ópticas y optoelectrónica
- e) Métodos holográficos

5) Radiación Ionizante

6) Acústica y vibraciones

- a) Acústica
- b) Vibraciones

7) Mediciones dimensionales

- a) Patrones primarios e interferometría
- b) Longitud y forma:
bloques patrón, redondez, ángulo, etc.
- c) Máquinas de coordenadas
- d) Rugosidad

8) Fuerza y Presión

- a) Fuerza y par torsional
- b) Presión y vacío
- c) Dureza y tenacidad

9) Masa y densidad

- a) Masa
- b) Densidad

10) Flujo y Volumen

- a) Flujo de líquidos
- b) Flujo de gas
- c) Grandes volúmenes
- d) Pequeños volúmenes

11) Viscosidad y Reología

12) Metrología en química

- a) Métodos primarios
- b) Metrología de gases
- c) Medición de pureza

13) Materiales de referencia

- a) Disoluciones
- b) Matriz simple
- c) Matriz compleja
- d) Desarrollo de materiales de referencia

14) Aplicaciones de materiales de referencia

- a) Alimentos
- b) Sistemas biológicos y medicina
- c) Medio ambiente
- d) Geoquímica y minerales
- e) Materias primas
- f) Metalmecánica
- g) Mezclas de gases
- h) Minera
- i) Clínicos
- j) Sector agrícola

15) Incertidumbre de la medición

16) Control estadístico de procesos

17) Validación de métodos

18) Sistemas de calidad

19) Normalización

20) Acreditación

21) Comparaciones entre laboratorios y pruebas de aptitud

22) Automatización de sistemas de medición

23) Procesamiento de imágenes

24) Metrología legal y aprobación de modelo de instrumentos de medición

25) Educación en metrología

26) Temas generales de metrología